تحضير أفلام رقيقة من الجرمانيوم بسماكات

مختلفة وتعيين بعض خصائصها البنيوية والضوئية

علي عبدالله *، رياض العبدالله * *، أيمن كسيبي * *

ملخص البحث

تم في هذا البحث تحضير أفلام رقيقة من الجرمانيوم بالاعتماد على تقانة التبخير الحراري في الخلاء (mbar⁵ 10⁻⁵)، تم التأكد من بنية الأفلام المحضرة باستخدام تقنية (XRD) أظهرت النتائج أن الأفلام المحضرة كانت من النمط غير البلوري وعند معالجتها حرارياً تتحول الى النمط البلوري المكعبي متمركز الوجوه (FCC) بثابت شبكة قدره (Å 5.649). معند معالجتها حرارياً تتحول الى النمط البلوري المكعبي متمركز الوجوه (FCC) بثابت شبكة قدره (Å 5.649). معاينة سطح الأفلام المحضرة باستخدام مجهر القوة الذرية (AFM) والذي يعطي صور ثنائية (2D) وثلاثية الأبعاد (3D) لسطح الأفلام الرقيقة وتبين أن نمو البلورات في الأفلام المتبلورة يتجه نحو الأعلى. أما الأفلام غير البلورية ظهرت خالية من التضاريس ويلاحظ غياب كامل للقمم فيها وكان السطح متجانساً على كامل امتداد الأفلام. الأفلام. المعاين بعض الخصائص الضوئية للأفلام المحضرة (النفوذية، الانعكاسية) وتم الأفلام. معامل الامتصاص وطاقة عرض المجال المحظور للأفلام المحضرة بنمطيها البلوري وعند الساحم وعند المحائية.

كلمات مفتاحية: أفلام رقيقة، جرمانيوم، التبخير الحرارى، فجوة الطاقة.

*) طالب ماجستير في فيزياء المادة الكثيفة – قسم الفيزياء – كلية العلوم- جامعة البعث- حمص- سوريا.
**) أستاذ في قسم الفيزياء – كلية العلوم- جامعة البعث- حمص- سوريا.

Preparation of germanium thin films with different thicknesses and study of their structural and optical properties

Ali Abdullah*, Reiad Al-Abdallah **, Ayman Ksibe **

Abstract

In this research, thin films of germanium were prepared based on the vacuum thermal evaporation technique (10^{-5} mbar).

The structure of the prepared films was confirmed using (XRD) technique, which showed that the prepared films were of a noncrystalline type and when heat treated they turn into a facecentered cubic crystal (FCC), with a network constant of (5.649 Å).

The surface of the prepared films was previewed using atomic force microscop (AFM) which gives 2D and 3D images of the surface of the thin films and it was found that the crystal growth in the crystallized films is upwards. As for the non-crystalline films, they appeared free of topography and a complete absence of peaks was observed, and the surface was homogeneous over the entire length of the films.

The optical properties of the prepared films (tramsmmitance, refletance) were studied, through which the absorption coefficient was calculated and the energy gab of the prepared films with their crystalline and non-crystalline patterns at different thicknesses was found.

Keywords: thin films, germanium, thermal evaporation, energy gab.

- *) Ms Student, Department of Physics-Faculty of science-Al-baath university Homs-Syria.
- **) professor of Physics, Department of Physics -Faculty of science- Al-baath university Homs-Syria.

1– مقدمة:

تعتمد أغلب الأجهزة الإلكترونية الحديثة في عملها على مواد ذات خصائص فيزيائية مميزة ألا وهي المواد نصف الناقلة (Semiconductor) التي تملك خصائص المواد العازلة عند درجات الحرارة المنخفضة، كما لها القدرة على النقل الكهربائي عند إرتفاع درجة حرارتها إلى حد معين [1].

نتيجة لتلك الخصائص الهامة بدأت العديد من المؤسسات العلمية أبحاثاً موسعة للتعرف على الخصائص البنيوية والضوئية وكذلك الكهربائية لهذه المواد وإمكانية الإستفادة القصوى منها عملياً، حيث أثمرت هذه الأبحاث عن تصنيع المقاومات الكهربائية بأنواعها المختلفة (الضوئية والحرارية) بدءاً من عام 1886 ومن ثم صناعة الديودات والترانزستورات عام 1964 ومن ثم الخلايا الشمسية والدارات الإلكترونية المتكاملة [2].

لا شك أن صناعة الترانزستور (أساس الدارات المتكاملة) خلقت ثورة علمية وصناعية في مجال صناعة الدارات الالكترونية فقد أمكن تصغير حجمها مئات المرات (بل تصل الى ملايين المرات كما في المعالجات الرقمية والحاسوبية) وزيادة كفائتها وخفض تكلفتها، والجدير بالذكر أن أول ترانزستور تمت صناعته بالاعتماد على الخصائص نصف الناقلة لعنصر الجرمانيوم (Ge) عام (1947) من قبل العلماء نصف الناقلة لعنصر الجرمانيوم (Ge) عام (J. Bardeen, W. H. Brattain, W. B. Shockley) من الجرمانيوم والسيليكون ينتميان إلى العمود الرابع من الجدول الدوري وخصائصهما متقاربة إلا أن مادة السيليكون قد هيمنت على إنتاج الترانزستورات والدارات المتكاملة وذلك بسبب رخص ثمنها وتوافرها بكميات كبيرة [5].

لم تتوقف الثورة التقنية مجال صناعة الدارات الالكترونية على استخدام أنصاف النواقل بصورتها المعروفة، بل تعدتها بكثير (وذلك بالاعتماد على نتائج الأبحاث العلمية) حتى وصلت لصناعة طبقات رقيقة من هذه المواد (أطلق عليها اسم الأفلام الرقيقة)

ذات فعالية كبيرة وخصائص متميزة تفوق خصائص مادتها الأصلية بشكلها الأولي [6].

تعرف الأفلام الرقيقة على أنها عبارة عن مواد كيميائية تحضر على هيئة طبقة أو عدة طبقات من ذرات المادة (أو جزيئاتها) لا تتعدى سماكتها (1μm) [7,8] إذ ترسب هذه الأفلام على مواد صلبة تعرف بالركائز، وتعتبر تقنية الأفلام الرقيقة واحدة من أهم التقنيات التي ساهمت وبشكل كبير في تطوير دراسة أنصاف النواقل كما تعددت إستخداماتها وتطبيقاتها، حيث سيطرت على أغلب الميادين العلمية والصناعية نذكر منها: الإلكترونيات، الضوئيات، الطلاء... [9].

حضرت الأفلام الرقيقة من مواد كيميائية مختلفة بعضها أنصاف نواقل بغرض استخداماتها الصناعية، ويعد الجرمانيوم (Ge) أهم هذه المواد بل كان أساسها ودراسته بشكل مفصل فتحت الباب على مصراعيه لدراسة أنصاف نواقل أخرى.

الجرمانيوم (Ge) عنصر كيميائي من المجموعة الرابعة في جدول مندلييف الدوري، وزنه الذري (Ge) وهو صلب في حالته الطبيعية وينصهر عند الدرجة (°C) و58.5 (°C).

يمتلك الجرمانيوم البلوري بنية بلوررية مكعبية متمركزة الوجوه (FCC) ثابتها يأخذ القيمة (a=5.657 Å) وتشغل ذرات الجرمانيوم رؤووس المكعب ومراكز الوجوه فيه.

ونظراً للخصائص الضوئية الهامة التي تبديها أفلام الجرمانيوم فقد تم استخدامها بكثرة في صناعة الكواشف الضوئية وخاصة الاشعاعية منها. حيث يمثل كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة الأساس في تقنيات التحليل بأشعة غاما ولحد الآن لازال هذا الكاشف الأفضل من نوعه والأكثر حساسية [10].

ويبين الشكل التالي بنية نموذجية للعصابات الطاقية في الجرمانيوم حيث يلاحظ وجود نهاية صغرى لعصابة الناقلية لا تقع فوق قمة عصابة التكافؤ مباشرة، مما يعبر عن الجرمانيوم بأنه نصف ناقل غير مباشر. مجلة جامعة البعث المجلد 44 العدد 4 عام 2022 على عبدالله رياض العبدالله أيمن كسيبي

يوافق هذا الوضع انتقالات الكترونية لا مباشرة تحدد الامتصاص أو الاصدار الأكثر احتمالاً، وفي هذه الحالة يكون عرض الفجوة الطاقية (0.6 eV≤ E_{gi} ≤0.8 eV) في حين أننا نلاحظ وجود قاع آخر في عصابة الناقلية يقع مباشرة فوق قمة عصابة التكافؤ مما يشير الى وجود فجوة طاقية مباشرة B ≥0.8 eV ≤ E_{gi}.



الشكل (1) المخطط الطاقى للجرمانيوم

2- هدف البحث:

يهدف البحث لتحضير أفلام الجرمانيوم البلورية وغير البلورية بسماكات مختلفة، بالاعتماد على تقنية التبخير الحراري تحت الضغط المنخفض.

تعيين بعض الخصائص البنيوية والضوئية لأفلام الجرمانيوم المحضرة وبيان تأثير سماكة الفلم المحضرر والمعالجة الحرارية على خصائص هذه الأفلام ومقارنة النتائج مع الدراسات المرجعية السابقة.

3- الإجراء التجريبي والتوصيف:

1.3. تحضير الأفلام:

تم ترسيب أفلام رقيقة من الجرمانيوم عالي النقاوة (%99.99) على ركائز زجاجية نظيفة تماماً ذات أبعاد (2cmx4cm) باستخدام منظومة التبخير الحراري في الخلاء تحت ضغط مخفف قدره (mbar) المتواجدة لدى هيئة الطاقة الذرية في دمشق.

توضع كمية من الجرمانيوم النقي في بوتقة خاصة من التنغستن يمر من خلالها تيار كهربائي فتبدأ حرارتها بالارتفاع ويبدأ الجرمانيوم بالتبخر ويترسب على الركازة الزجاجية التي تبعد عن البوتقة مسافة (12 cm).

تتغير كمية الجرمانيوم وزمن التسخين وشدة التيار تبعاً لسماكة الأفلام المطلوبة.

بعد انتهاء عملية الترسيب نحصل على أفلام الجرمانيوم الرقيقة غير البلورية، ولتحويلها الى بلورية فقد تم معالجتها حرارياً بدرجات حرارة مختلفة لمدة (30) دقيقة حيث لوحظ أنها تحتفظ بطورها اللامتبلور حتى الدرجة (C° 500) وكانت درجة الحرارة التي يتحول عندها الفلم اللامتبلور الى فلم متبلور هي (C° 525).

2.3. توصيف الأفلام المحضرة:

تم استخدم جهاز انعراج الأشعة السينية (XRD) من انتاج شركة (STOE) الألمانية المتواجد لدى هيئة الطاقة الذرية لدراسة الخصائص البنيوية للأفلام المحضرة ضمن مجال زوايا انعراج (80^{0–20}0)20. أما بالنسبة لدراسة سطح الأفلام فقد استعنا بجهاز مجهر القوة الذرية (AFM) المتواجد لدى هيئة الطاقة الذرية والذي يعطي صور ثلاثية الأبعاد عالية الوضوح للطبقة السطحية من الأفلام.

استخدم جهاز المطيافية (Spectrophotometer) لقياس طيفي النفوذية والانعكاسية الضوئية من أجل تعيين بعض الخصائص الضوئية.

4- النتائج والمناقشة:

1-4- الدراسة البنيوبة للأفلام المحضرة باستخدام تقنية (XRD):

يبين الشكل التالي مخطط انعراج الأشعة السينية للأفلام الرقيقة قبل المعالجة الحرارية وتبدو هذه الأفلام غير متبلورة (ammorphous) ويعود ظهور الهضبة في بداية الطيف للركيزة الزجاجية غير المتبلورة .



الشكل (2) أطياف (XRD) لأفلام الجرمانيوم قبل التلدين والمحضرة بسماكات مختلفة (a:400 nm, b:900 nm)



بينما يبين الشكل (3) أطياف (XRD) للأفلام المعالجة حرارياً عند الدرجة (℃525):

الشكل (3) أطياف (XRD) لأفلام الجرمانيوم بعد التلدين والمحضرة بسماكات مختلفة (a:400 nm, b:900 nm)

يلاحظ ظهور خمس قمم عائدة للجرمانيوم وفق نمط التبلور (المكعبي) وفق التوجهات البلورية [242] ,[131] ,[242] ,[111] وهو ما تم تأكيده بالمقارنة مع البطاقة المرجعية ذات الرقم (1051-901-96).

وبالاعتماد على نتائج مطيافية (XDR) قمنا بحساب ثوابت الشبكة البلورية بالاعتماد على قانون براغ في الانعراج وعلاقة ثوابت الشبكة البلورية بالمسافة بين المستويات البلورية [12]:

$$n\lambda = 2d\sin\theta$$
$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$$
$$a = d\sqrt{(h^2 + k^2 + l^2)}$$

حيث λ=1.540589 Å

رتبت النتائج وفق الجدول التالي:

الجدول (1) قيم (20, hkl, d, a) لأفلام الجرمانيوم المحضرة بسماكات مختلفة (1) (400nm, 900nm)

	t=400	nm		t=900 nm			
(20)°	(h,k,l)	d	a	(20)°	(h,k,l)	d	a
27.357	111	3.257	5.642	27.298	111	3.264	5.654
45.451	022	1.993	5.639	45.421	022	1.995	5.643
53.777	131	1.703	5.648	53.815	131	1.702	5.645
72.960	133	1.296	5.647	72.896	133	1.297	5.652
83.888	242	1.152	5.645	83.921	242	1.152	5.644
$\bar{a} = 5.645 \text{ Å}^{0}$			$\bar{a} = 5.648 \stackrel{0}{\text{A}}$				

يلاحظ من هذه النتائج التقارب الكبير بين متوسط قيم (a) بعد الشبكة البلورية للأفلام المحضرة مع القيمة الواردة في البطاقة المرجعية وهي (a=5.680 Å).

بعد ذلك قمنا بحساب حجم الحبيبات المتشكلة بالاعتماد على علاقة شيرر [13]:

$$D = \frac{K\lambda}{\beta_{FWHM}.\cos(\theta)}$$

كذلك حسبت كثافة الانخلاعات (δ) والتي تعرف بأنها المسافة بين خطوط الانخلاع لكل وحدة حجم من البلورة وتحسب وفق العلاقة :

$$\delta = \frac{1}{D^2}$$

أما الاجهاد الداخلي (٤) فيعرف بأنه عيب ينشأ أثناء تشكل البلورة ويكون وجوده مقترناً بوجود العيوب البلورية بأنواعها المختلفة (النقطية والسطحية والحجمية) [13] وقد تم حسابه للأفلام المحضرة بالاعتماد على العلاقة [14]:

$$\varepsilon = \beta_{FWHM} \, \frac{\cos(\theta)}{4}$$

حيث (K) ثابت وقيمته (0.94)، و
$$eta_{\scriptscriptstyle FWHM}$$
 عرض القمة عند نصف الشدة وتقاس
بالراديان، و (D) أبعاد البلورات بواحدة (nm).

الجدول (2) قيم كل من أبعاد البلورات وكثافة الانخلاعات والاجهاد الداخلي لأفلام الجرمانيوم المحضرة عند سماكات مختلفة

t=400nm						
83.888	72.960	53.777	45.451	27.357	2θ(°)	
0.96	1.152	0.384	0.576	0.24	$eta_{\scriptscriptstyle FWHM}$ (°)	
11.62	8.957	24.226	15.617	35.581	D (nm)	
7.406	12.462	1.703	4.099	0.7898	$\delta(x10^{+15} line/m^2)$	
3.115	4.041	1.494	2.318	1.017	$\epsilon(x10^{-3})$	
t=900nm						
			t=900	nm		
83.921	72.896	53.815	t=900 45.421	0nm 27.298	2θ(°)	
83.921 0.958	72.896 1.148	53.815 0.379	t=900 45.421 0.569	0nm 27.298 0.237	2θ(°) β _{FWHM} (°)	
83.921 0.958 11.647	72.896 1.148 8.985	53.815 0.379 24.55	t=900 45.421 0.569 15.807	onm 27.298 0.237 36.027	2θ(°) β _{FWHM} (°) D (nm)	
83.921 0.958 11.647 7.371	72.896 1.148 8.985 12.386	53.815 0.379 24.55 1.659	t=900 45.421 0.569 15.807 4.001	0nm 27.298 0.237 36.027 0.7704	2θ(°) $β_{FWHM}$ (°) D (nm) δ(x10 ⁺¹⁵ lin e/m ²)	

مجلة جامعة البعث المجلد 44 العدد 4 عام 2022 على عبدالله رياض العبدالله أيمن كسيبي

نلاحظ من النتائج السابقة أن أبعاد البلورات للفلم المحضر عند سماكة (900nm) أكبر من مثيلاتها للفلم المحضر عند السماكة (400nm) وهذا يدل على نمو البلورات بشكل أكبر وانخفاض العيوب المتشكلة فيها وهذا ما دل عليه انخفاض كثافة الانخلاعات والاجهاد الداخلي. الأمر الذي يتوافق مع كون (β400nm) أكبر من (β900nm) مما يعني أن (D400nm) أصغر من (D900nm) وهذا السلوك يتوافق مع علاقة شرر.

2-4- معاينة سطح أفلام الجرمانيوم المحضرة:

تم معاينة طبوغرافية سطح الأفلام المحضرة باستخدام مجهر القوة الذرية (AFM) ذو القدرة العالية على التكبير والمتواجد لدى هيئة الطاقة الذرية في دمشق، وتم اختيار مقطع سطحي من الأفلام الرقيقة بأبعاد ثابتة (5x5μm) وبسماكة سطحية تختلف تبعاً لتغير تضاريس الفلم المحضر.

الشكل التالي يبين صورة مجهر القوة الذرية لأفلام الجرمانيوم غير المتبلورة بسماكات مختلفة إضافة لمخطط المقطع الخطى الخاص بكل صورة:



الشكل (4) صور مجهر القوة الذرية لأفلام الجرمانيوم غير البلورية المحضرة a: سماكة b ،400 nm: البروفايل الخطي عند سماكة c ،400 nm: سماكة am d : البروفايل الخطي عند سماكة mm

يلاحظ من الشكل السابق أن الأفلام غير المتبلورة مستوية تماماً وخالية من التضاريس ومتجانسة طبوغرافياً على كامل مساحة سطح الفلم. وهذا ما أكدته منحنيات المقطع الخطي لكلا الفلمين المحضرين حيث لم يتجاوز ارتفاع أعلى قمة فيهما (6 nm). وهذا يدل أيضاً على عدم وجود نمو بلوري وفق اتجاهات محددة، الأمر الموافق للدراسة البنيوية (XRD) للأفلام اللابلورية وهي تعتبر قريبة من الاستواء الضوئي (من رتبة $\frac{\lambda}{100}$) المثالي فمثلاً من أجل طول موجة وسطي الموالي يكون $500 \, \mathrm{m}$

يبين الشكل (5) صورة مجهر القوة الذرية لأفلام الجرمانيوم المتبلورة بسماكات مختلفة اضافة لمخطط البروفايل الخطي الخاص بكل صورة:



الشكل (5) صور مجهر الفوه الدرية لأفلام الجرمانيوم البلورية المحضره ي سماكة b ،400 nm: البروفايل الخطي عند سماكة c ،400 nm: سماكة b ،400 nm: البروفايل الخطي عند سماكة mm 900 nm

مجلة جامعة البعث المجلد 44 العدد 4 عام 2022 علي عبدالله رياض العبدالله أيمن كسيبي

نلاحظ من الشكل السابق (a,b) ظهور سطح الأفلام البلورية (400 nm) على شكل قمم وتضاريس غير متجانسة في معظمها وتمتد على كامل السطح. حيث يلاحظ أعلى ارتفاع للقمم وفق منحني البروفايل الخطي (14 nm) إضافة أن هذه القمم تمتد بشكل غير متجانس على كامل السطح، أما بالنسبة للأفلام المحضرة عند سماكة (900 nm) الشكل (c,d) فيلاحظ ازدياد ارتفاع القمم لتصل حتى (35 nm) وهي تمتد أيضاً بشكل غير متجانس على كامل السطح.

ازدياد ارتفاع القمم في الأفلام البلورية عند سماكة (900 nm) يدل على نمو البلورات وفق اتجاهات محددة وازدياد الحجم البلوري نتيجة زيادة سماكة الأفلام. وهذه النتيجة تؤكد ما توصلنا اليه من خلال دراستنا البنيوية لأفلام الجرمانيوم.

يبين الجدول التالي قيم خشونة السطح للأفلام المحضرة اضافة لارتفاع وانخفاض القمم والقعر على السطح:

	Amo 900nm	Crys 900nm	Amo 400nm	Crys 400nm
الخشونة (nm)	0.4783	3.744	0.3897	2.2644
متوسط الخشونة (nm)	0.3563	2.8516	0.2713	1.4143
أعلى ارتفاع قمة (nm)	6.3875	35.2406	4.7406	14.7813
أدنى انخفاض قعر (nm)	3.1110	14.3564	2.4791	12.5162

الجدول (3) قيم خشونة السطح للأفلام المحضرة اضافة لارتفاع وانخفاض القمم والقعر على السطح

4-3- تعيين بعض الخصائص الضوئية لأفلام الجرمانيوم المحضرة بسماكات مختلفة:

1-3-4 دراسة أطياف النفاذية والانعكاسية:

تقوم دراسة الخصائص الضوئية للأفلام المحضرة على دراسة أطياف النفوذية (T) والانعكاسية (R) الضوئية اضافة للامتصاصية (Abs) حيث أمكن حساب معامل الامتصاص (α) كما سنرى في الفقرة (4-3-2).

وهنا تجدر الاشارة الى أن عدد الأفلام المحضرة هو أربعة أفلام (اثنان عند كل سماكة، أحدهما متبلور والآخر غير متبلور).



يبين الشكل التالى منحنيات النفاذية والانعكاسية الضوئية للأفلام المحضرة.



يلاحظ من جميع الأطياف السابقة وبشكل عام تعاكس بسلوك النفاذية والانعكاسية، ونلاحظ أيضاً أن هذه المنحنيات تبدأ انسيابية ثم تظهر فيها نهايات عظمى وصغرى متتالية ويزداد عددها وتزداد حدتها بزيادة السماكة، ويعود وجود هذه الأهداب إلى التداخل متعدد الانعكاسات ضمن الطبقة الرقيقة.

وباجراء مقارنة بين الأفلام ذات السماكات المختلفة نحصل على الشكل (7)، وفيه نلاحظ أن النفاذية الضوئية في الأفلام ذات السماكة الأعلى (900nm) منزاحة نحو الأطوال الموجية الأكبر وذات شدة أقل من النفاذية للأفلام ذات السماكة المنخفضة (400nm) ويفسر ذلك بأن زيادة السماكة تؤدي لزيادة امتصاص الضوء من قبل الأفلام وبالتالي تتخفض شدة الضوء النافذ.

إن انزياح (T) للأفلام بزيادة السماكة نحو الأطوال الموجية الأطول يشير إلى انزياح حد الامتصاص نحو الطاقات الأقل الأمر الذي ينبئ بانخفاض عرض المجال المحظور بازدياد السماكة.





مجلة جامعة البعث المجلد 44 العدد 4 عام 2022 على عبدالله رياض العبدالله أيمن كسيبى

a: أفلام الجرمانيوم غير البلورية، b: أفلام الجرمانيوم البلورية

4-2-3- امتصاص الضوء:

يحدث امتصاص الضوء في الأفلام الرقيقة نتيجة الانتقالات الالكترونية من منطقة التكافؤ إلى منطقة الناقلية.

يعبر عن ارتباط ظاهرتي النفوذية (T) والانعكاسية (R) بالامتصاصية من خلال قانون انحفاظ الطاقة المعبر عنه بالعلاقة التالية:

 $I_0 = I_R + I_T + I_A$

حيث (I_0) شدة الضوء الساقط على العينة، (I_R) شدة الضوء المنعكس، (I_T) شدة الضوء المنعكس، (I_0) شدة الضوء النافذ من العينة بينما (I_A) شدة الضوء الممتص من قبل العينة. وبقسمة طرفي العلاقة السابقة على (I_0) نحصل:

$$1 = \frac{I_R}{I_0} + \frac{I_T}{I_0} + \frac{I_A}{I_0}$$
$$1 = R + T + A$$

حيث تمثل (R) الانعكاسية وتمثل (T) النفاذية بينما تمثل (A) الامتصاصية.

وترتبط شدة الضوء النافذ من العينة ذات السماكة (t) بمعامل امتصاص المادة من خلال قانون بير -لامبرت [15]:

$$I_T = I_0 e^{-\alpha t}$$

وبالأخذ بعين الاعتبار تأثير الانعكاسات على السطح الخلفي للعينة (حيث ظاهرة التداخل متعدد الانعكاسات يفضل استخدام العلاقة الأدق بالنسبة لأفلامنا [16]:

$$I_T = (1 - R)I_0 e^{-\alpha t}$$
$$\frac{I_T}{I_0} = (1 - R)e^{-\alpha t}$$
$$\frac{T}{1 - R} = e^{-\alpha t}$$
$$\ln(\frac{T}{1 - R}) = -\alpha t$$
$$\alpha = -\frac{1}{t}\ln(\frac{T}{1 - R})$$
$$\alpha = \frac{1}{t}\ln(\frac{1 - R}{T})$$

وعليه قمنا بحساب معامل الامتصاص للأفلام المحضرة وبيان تغيراته بدلالة طاقة الفوتون كما في الشكل التالي:



الشكل (8) معامل الامتصاص لأفلام الجرمانيوم البلورية وغير البلورية عند ذات السماكة ولملاحظة تأثير السماكة على الامتصاص نعرض معامل الامتصاص للسماكتين (400nm, 900nm) المتبلورتين في الشكل (9):



الشكل (9) معامل الامتصاص لأفلام الجرمانيوم البلورية عند سماكات مختلفة

يلاحظ من الشكل (9) أن معامل الامتصاص يكون أكبر عند السماكة الأعلى مما يدل على زيادة الامتصاصية بزيادة سماكة الفلم بسبب الانخفاض في العيوب البنيوية وعيوب التراص [17] وهذا ما استنتجناه سابقاً عند دراسة طيف النفوذية الضوئية.

E_g تعيين فجوة الطاقة E_g:

تعرف فجوة الطاقة بأنها أقل طاقة لازمة لانتقال الالكترون من منطقة التكافؤ الى منطقة الناقلية وبهذا نطلق مفهوم حد الامتصاص واقترحت العديد من النماذج النظرية لحسابها ومن أهمها نموذج (Mott and Davis, 1971) المعطى بالعلاقة [18]:

$$\alpha h \upsilon = B \left(h \upsilon - E_g \right)^n$$

حيث B ثابت يتبع لنوع المادة، وإلى حد ما تعبر هذه العلاقة تجريبية وتستخدم لحساب عرض الفجوة الطاقية الضوئية (E_{opt}) بتقريب جيد فهي تتأرجح حول القيمة الحقيقية وهذا يرتبط بشروط التحضير ودرجة الحرارة وبكون الأفلام متبلورة أو لا متبلورة وغيرها من العوامل الأخرى.

تأخذ m قيماً تعتمد على طبيعة الانتقالات الضوئية:

m=1/2 من أجل الانتقالات المباشرة المسموحة.
 m=3/2 من أجل الانتقالات المباشرة غير المسموحة.
 m=2 من أجل الانتقالات غير المباشرة وغير المسموحة.
 m=3 من أجل الانتقالات غير المباشرة وغير المسموحة.

ومن الجدير ذكره أن البنية الالكترونية للجرمانيوم تشير الى وجود الانتقالات المباشرة وغير المباشرة، ولحساب عرض الفجوة الطاقية الموافقة قمنا بتقسيم طيف الامتصاص للجرمانيوم الى منطقتين موافقتين لنوعي الانتقالات الإلكترونية السابقة وحسبنا (E_{gi}) للانتقالات غير المباشرة انطلاقاً من العلاقة:

$$\alpha h \upsilon = B \left(h \upsilon - E_g \right)^2$$

وذلك برسم تغيرات المقدار $(\alpha hv)^{1/2}$ بدلالة طاقة الفوتون (hv) وذلك من أجل الأفلام المتبلورة وغير المتبلورة وعند سماكتين مختلفتين (400nm, 900nm) وعينا (E_{gi}) من تقاطع ممدد الجزء المستقيم مع محور (hv) مقدرة بـ (eV). وبطريقة مشابهة قمنا بتحديد (E_{gd}) للانتقالات المباشرة انطلاقاً من العلاقة: $\alpha hv = B (hv - E_g)^{1/2}$

وذلك برسم تغيرات المقدار ²(αhv) بدلالة طاقة الفوتون (hv) وذلك من أجل الأفلام المتبلورة وغير المتبلورة وعند سماكتين مختلفتين (400nm, 900nm) وعينا (E_{gd}) أيضاً من تقاطع ممدد الجزء المستقيم مع محور (hv) مقدرة بـ (eV).

يظهر الشكل (10) قيمة الفجوة الطاقية المباشرة وغير المباشرة لأفلام الجرمانيوم البلورية وغير البلورية المحضرة عند سماكة (400 nm).





بينما يظهر الشكل (11) قيمة الفجوة الطاقية المباشرة وغير المباشرة لأفلام الجرمانيوم البلورية وغير البلورية المحضرة عند سماكة (900 nm).





بلوري

رتبت قيم الفجوة الطاقية المباشرة وغير المباشرة المستخلصة من الأشكال السابقة في الجدول التالي لسهولة المقارنة بينها:

الجدول (4) قيم الفجوة الطاقية المباشرة وغير المباشرة لأفلام الجرمانيوم المتبلورة وغير الجدول (4)

		الفجوة الطاقية	الفجوة الطاقية
		المباشرة	غير المباشرة
		$\mathbf{E_{gd}}$	$\mathbf{E_{gi}}$
سماكة t= 400 nm	أفلام متبلورة	0.855 eV	0.620 eV
	أفلام غير متبلورة	0.920 eV	0.645 eV
سماكة t= 900 nm	أفلام متبلورة	0.790 eV	0.600 eV
	أفلام غير متبلورة	0.880 eV	0.640 eV

نلاحظ أن قيمة الفجوة الطاقية للانتقالات غير المباشرة في الأفلام البلورية أقل من قيمتها في الأفلام غير البلورية وهذا يدل على أن عملية التبلور تخفض الفارق الطاقي بين قمة مجلة جامعة البعث المجلد 44 العدد 4 عام 2022 علي عبدالله رياض العبدالله أيمن كسيبي

عصابة التكافؤ وقعر عصابة الناقلية وهذا متوافق مع المراجع [21–19]، ونعيد السبب إلى انتظام توزع الذرات في بنية بلورية مما يخفف من عشوائية توزع الذرات. أما بالنسبة لقيمة الفجوة الطاقية للانتقالات المباشرة نلاحظ التغير في السلوك تبعاً للسماكة، فعند السماكة (400 nm) نلاحظ أن قيمة الفجوة الطاقية أكبر من مثيلاتها عند السماكة ما يعند السماكة (900 nm) وذلك بسبب ميل الأفلام الرقيقة لسلوك المادة العازلة بانخفاض السماكة على اعتبار أن زيادة السماكة تؤدي الى تراص أفضل وانخفاض العيوب البلورية وبالتالي نقصان (E_q) وزبادة الامتصاص.

5- الخلاصة والاستنتاجات:

- 1- تم تحضير أفلام رقيقة من الجرمانيوم (Ge) غير البلورية المرسبة على ركائز زجاجية بسماكات مختلفة وتم تحويلها بالتلدين الحراري الى أفلام بلورية من النمط البلوري المكعبي متمركز الوجوه (FCC) بثابت شبكة بلورية وسطي قدره (a=5.646Å).
- 2- يبين معامل الامتصاص بوضوح حدي الامتصاص المتعلقين بالانتقالات المباشرة وغير المباشرة في أفلام الجرمانيوم المحضرة بنمطيها البلوري وغير البلوري.
- 3- أثبتت صور مجهر القوة الذرية (AFM) تشكل بنية بلورية في الأفلام الملدنة الى الدرجة (C° 525)، حيث ظهرت البلورات المتشكلة على شكل قمم محددة الاتجاه (نحو الأعلى) تملأ سطح الفلم بشكل غير متجانس تقريباً. ولوحظ ازدياد ارتفاع هذه القمم نتيجة زيادة سماكة الفلم المحضر مما دل على نمو البلورات.
- 4− إن قيم (E_g) في مجال الامتصاص بالانتقالات الالكترونية غير المباشرة وكانت (E_g) في مجال المتبلورة.
- 5- حسبت قيم (E_g) في مجال الامتصاص بالانتقالات الالكترونية المباشرة وكانت −5 القيمة تختلف تبعاً للسماكة حيث أنها أعلى عند السماكة (400 nm) مقارنة بالسماكة (900nm).

المراجع:

- 1. H. T. GRAHN, "Introduction to semiconductor physics", World scietific publishing, London, P.1-10, (2001).
- 2. Dautremont–Smith WC. Hydrogen in III–V Semiconductors. MRS Online Proceedings Library Archive. 1987;104.
- 3. I. BERGER, "Semiconductor Materials", CRC Press, New York, P. 15-35 (1997).
- 4. SINGH R, HARAME DL, OPRYSKO MM. SILICON GERMANIUM Technology, Modeling, and Design. United States of America: A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION; 2004.
- 5. A. TRIBBLE, "Electrical engineering material and devices", University of Lowa, Lowa, (2002).
- 6. A. Z. MOSHFEGH, H. V. KANEL, S. C. KASHYAP and M. WUTTIG, "Physics and technology of thin films", World scietific publishing, London, P.1-10 (2003).
- 7. Heavens OS. The Film physics. Methuen Young Co. Ltd. 1970.
- 8. R. UEDA and J. B. MILLIN, "Crystal Growth and Characterization", Mc Graw-Hill, (1975).
- 9. Harsha KS. Principles of vapor deposition of thin films. Elsevier; 2005 Dec 16.
- 10. Stenzel O. The Physics of Thin Film Optical Spectra. New York: Springer; 2015.
- 11. Levinstein M, Rumyantsev S, Shur M. Handbook Series on Semiconductor Parameters. World Scientific; 1996.
- Yücel E, Güler N, Yücel Y. Optimization of deposition conditions of CdS thin films using response surface methodology. J Alloys Compd [Internet]. 2014 Mar;589:207–12. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925838813027 977
- 13. Reddy TS, Kumar MCS. Effect of substrate temperature on the

physical properties of co-evaporated Sn2S3 thin films. Ceram Int [Internet]. 2016 Aug;42(10):12262–9. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272884216305 818

- 14. Kariper I. Optical and structural properties of CdSe thin film produced by chemical bath deposition. J Non-Oxide Glas. 2016;1(8):1–9.
- 15. Dhanam M, Prabhu RR, Manoj PK. Investigations on chemical bath deposited Cadmium Selenide thin films. Mater Ch Phy. 2008;107:289–96.
- 16. العيسى ح, العبدالله ر, كسيبي أ. دراسة معامل الامتصاص a انطلاقاً من طيفي
 16. الانعكاسية Rm والنفاذية Tm لفلم رقيق من المركب AlSb وتحديد مجاله
 المحظور .Eg مجلة جامعة البعث. 2020(12):42:2020 .
- Makori N. Optical and electrical properties of SnSe thin films for solar cell applications. Am J Condens Matter Phys. 2014;5(4):87–90.
- 18. Tobergte, D.R. and Curtis, S. (2013) The Physics of Thin Film Optical Spectra: An Introduction. .
- Liu P, Longo P, Zaslavsky A, Pacifici D. Optical bandgap of single- and multi-layered amorphous germanium ultra-thin films. J Appl Phys [Internet]. 2016;119(1). Available from: http://dx.doi.org/10.1063/1.4939296
- Liu H, Li S, Sun P, Yang X, Liu D, Ji Y, et al. Study on characterization method of optical constants of germanium thin films from absorption to transparent region. Mater Sci Semicond Process [Internet]. 2018;83(April):58–62. Available from: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2018.04.019
- 21. Goh ESM, Chen TP, Sun CQ, Liu YC. Thickness effect on the band gap and optical properties of germanium thin films. J Appl Phys. 2010;107(2).